Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/683,536	HSIEH ET AL.
Examiner	Art Unit

Ren L. Yan

2854

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
399	379 380 363 16	6/9/05	Rije
	363		
	16		
<u>.</u> .			
400	691		
	692		
	691 692 693		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			:

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR